

Date de la demande :

**DEMANDE DE PRESTATION  
EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE  
Appareil : MEB- FEG Zeiss Supra 40**

Référence de la demande :

Référence devis si extérieur :

**Demander :**

**NOM**

Prénom :

**Equipe de recherche :**

Si étudiant :

- **Nom du responsable :**

-  Doctorant  M2  M1

Courriel : Téléphone :

**Bureau :**

ITODYS  Collaboration :

Extérieur (=hors ITODYS) :

**Si demande d'étudiant, validation de l'encadrant :**

**Renseignements échantillons :**

Nombre d'échantillons :

Référence des échantillons (numérotation) :

**Type d'échantillons :**

Couche mince

Echantillon massif

Réseau

Poudre (colloïdes) dans un solvant

Préciser le type de solvant :

Conducteur

Isolant

dépôt carbone

dépôt platine

Dangereux :  Oui  Non

**But de l'observation :**

Indiquer ici en quelques mots la propriété ou l'information recherchée, utiles pour l'analyse MEB (taille, forme, nanostructuration ..... )

**Nb :** L'échantillon doit impérativement être séché (exempt de tout solvant), avant d'être transmis pour analyse sous peine de ne pas être analysé pour cause de dégazage excessif dans l'enceinte d'analyse.

Délai souhaité :

Délai accepté :

**Résultats d'observation :** Réseau 172-16.2.170 - MEB Public (Gam Derouich – Nom de responsable de groupe)

**Fiche à envoyer par mail à :**

**Jean-Christophe Lacroix:** lacroix@univ-paris-diderot.fr (Responsable scientifique)

et

**Sarra Gam Derouich:** sarra.derouich@univ-paris-diderot.fr (IE en charge de la plateforme MEB)